709

# 球圧子押込み疲労荷重下の TiN 被覆 WC-Co 超硬合金 における薄膜及び基板の破壊発生特性

滋賀県立大学 ○高松 徹 田邉 裕貴 滋賀県立大学[院] 堀井 重希

# Fracture initiation properties of TiN thin films deposited on the substrate under sphere indentation fatigue loading

# Tohru TAKAMATSU, Hirotaka TANABE, and Shigeki HORII

### 1緒 言

これまで筆者らは、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>バルク材、または TiN 被覆超硬合 金WC-Coを用いた静的球圧子押込み試験を行って、セラミ ックバルク材における極表面層,およびセラミック被覆材に おける薄膜の破壊強度評価,および破壊じん性評価に対す る評価法の有効性を示した(1)~(4).静的球圧子押込み試験 は、荷重増加中に表面層、または薄膜に生じるリングクラック の発生現象を利用した評価法である.しかし,硬さがWC-Co より小さな SK3 鋼を基板材とした TiN 被覆 SK3 鋼を用いて 試験した結果, 基板に大きな塑性変形を示し, リングクラック が発生しなかった. そこで筆者らは, 図1に示すような繰返し 荷重で球圧子を押込む試験(球圧子押込み疲労試験)を行 って,その有効性を検討している.なお,小さな繰返し荷重 を長時間負荷することにより、TiN 被覆 SK3 鋼でも, 薄膜に き裂・はく離が発生した.また,球圧子押込み疲労試験は, セラミック被覆材に繰返し荷重が長時間負荷された場合の 膜特性を検討することも目的としている.本研究では、球圧 子押込み疲労試験の有効性を明らかにすることを目的とし た研究の一環として, WC-Co 基板または TiN 被覆WC-Co について球圧子押込み疲労試験を行って,疲労過程中の 薄膜, 基板のき裂発生挙動を詳細に調べ, き裂発生寿命に 及ぼす押込み荷重の影響を調べた.

#### 2 実験方法

基板材として、硬さの異なる2種類の超硬合金 WC-Co, F 材, EM 材 (タンガロイ)を用いた.表1にそれぞれの機械的 性質を示す.表には、球圧子、TiN 薄膜の性質も示す.基板 の形状寸法を図2に示す.基板試験片(基板材)、および基 板の40×20mmの面にdcマグネトロンスパッタリング装置(ヒ ラノ光音製)を用いて 2.5 $\mu$ m 膜厚の TiN を被覆した試験片 (被覆材)を製作した.球圧子押込み疲労試験には、油圧サ ーボ式疲労試験機(テークスグループ,最大荷重  $P_{max}$ =1kN 以上、周波数40Hz)、電磁加振式疲労試験機(旭製作所、  $P_{max}$ =1kN 以下、周波数200Hz)を用い荷重比0.1の荷重制 御条件で行った.球圧子は、軸受用 HIP 焼結 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 球を用 い、球圧子径2*R*は、3.96(基板材は5.95)、7.93、12.6mm と した.試験中、所定の荷重繰り返し数ごとに試験を中断し、 デジタルマイクロスコープ、及び SEM を用いて押込み領域



Fig.1 Schematic of spherical indentation fatigue test

#### Table 1 Mechanical properties of the material

	Indenter	Substrate F type	Substrate EM type	Film
Material	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	WC-Co	WC-Co	TiN
Young's modulus E, GPa	304	610	550	415
Poison's ratio	0.28	0.21	0.22	0.19
Vickers hardness HV		2050	1650	



Fig.2 Shape and dimensions of the specimen.

を観察し,き裂の発生荷重繰り返し数を決定した.また,打ち切り回数は10<sup>7</sup>回とした.

# 3 実験結果および考察

図3は、基板材(EM材, 2*R*=7.93mm, *P<sub>max</sub>*=7.0kN)または 被覆材(EM材, 2*R*=12.6mm, *P<sub>max</sub>*=9.0kN)の疲労試験中に、 基板表面または薄膜に発生した円状のき裂(リングクラック) の例である. 基板材の場合、ある荷重繰返し数で、接触領 域近傍にほぼ完全なリングクラックが発生した. 被覆材の場 合、高荷重では、ほぼ完全なリングクラック,およびその周辺 にはく離を生じたが、低荷重ではリングクラックの一部と考え られる微視き裂が発生した箇所に、はく離を生じた. 詳細な 観察を行った結果、はく離はき裂発生直後に生じることがわ かった. また、基板がほとんど弾性変形状態でき裂が発生す ることもわかった. さらに、リングクラックは、これまでの静的 球圧子押込み試験と同様に、接触円の若干外側に発生す ることもわかった.

*P<sub>max</sub>*, 2*R* を変えた疲労試験を行って, 接触領域近傍にリ ングクラックの発生が観察された荷重繰返し数を *N<sub>i</sub>* として求 めた. ただし, 低荷重下の被覆材における *N<sub>i</sub>*は, はく離発生 荷重繰返し数として求めた. 被覆材の静的試験では, 薄膜 のリングクラック発生荷重において, 基板にもリングクラッ



(a) Substrate specimen (b) TiN coated specimen Fig.3 Appearance of ring crack

クが発生した.そこで、本研究でも被覆材における基板 表面を詳細に観察した結果、高荷重では基板にき裂発生 が確認できたが、低荷重では確認できなかった.また、 被覆材における基板のき裂発生は、膜のき裂発生直後で あることもわかった.

図4(a), (b)に, 基板材, 被覆材 (EM材)の疲労試験より得られた $P_{max} - N_i$ 関係を示す.静的試験の結果を $N_i = 1$ に示す. いずれの場合も、 $N_i$  は  $P_{max}$  の低下に従って増加する、および $P_{max} - N_i$ 関係は 2R に依存する傾向を示す.ある $N_i$ に対する  $P_{max}$  を比較すると、基板材の方が大きい.以上の傾向はF材基板の場合も同様であった.これまでの基板材、被覆材の静的球圧子押込み試験でも、リングクラック発生荷重  $P_i$ は明確な 2R 依存性を示した.しかし、 $P_i$ とリングクラック半径  $r_i$  から求めた、表面層または薄膜に生じる半径方向の引張応力 $\sigma_{r,i}$ は明確な 2R 依存性を示さないことがわかった.そこで、本研究も同様に  $P_{max} - N_i$ 関係から $\sigma_{r,i} - N_i$ 関係を求めた.

図 5(a), (b)は, 基板材, 被覆材の $\sigma_i - N_i$ 関係である. ばら つきはあるが,  $\sigma_i - N_i$ 関係は明確な 2R 依存性が見られず, 近似的には材料特性と見なせる. この傾向は F 材基板の場 合も同様であった. 被覆材について,  $N=10^7$ の時間強度を 求めると, 700~900MPa であり,静的試験からえられた値(約 2000MPa)の 35~45%であった. 基板材と被覆材の比較より, 基板材の $\sigma_{ri}$ の方が大きいことがわかった. ただし, 被覆材 の FEM 解析を行って被覆材における基板表面の応力を求 めた結果, 薄膜の応力より若干大きいことがわかった. しかし, 被覆材における基板の応力は, 基板材の $\sigma_{ri}$ より若干小さか った. すなわち, 被覆材における基板のき裂は, 薄膜のき 裂により引き起こされ, 強度が低下したと考えられる.

図 6(a), (b)に, 被覆材の  $P_{max} - N_i$ 関係,  $\sigma_i - N_i$ 関係を, F 材とEM 材で比較したものを示す(2R=12.6mm).  $P_{max} - N_i$ 関係は, 若干の差が認められる. その要因として, 基板硬さの 影響が考えられる. しかし上記のように, き裂発生時の接触



領域にはほとんど塑性変形が認められないので、表1で示したように、基板のヤング率の影響が考えられる. 図 6(b)より、両基板材の $\sigma_{ri} - N_i$  関係はほぼ一致し、基板硬さ、ヤング率に依存しない特性が得られることがわかる.

# 4 結 言

TiN 被覆WC-Co 被覆材の $\sigma_{ri} - N_i$ 関係は, 広範囲の寿命 領域で 2R, 基板材質に依存しない. 以上から, 球圧子押込 み労試験は, 繰返し荷重条件下のセラミック被覆材における 薄膜の特性評価法として有効と考えられる.

